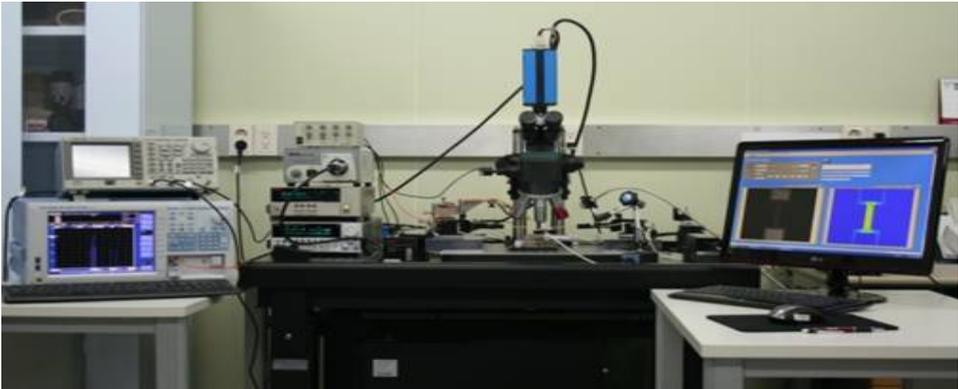


반도체 소자 불량분석 장치 및 방법

기술유형	기술이전기업	계약액	이전대상 기술
특허	(주)모두 테크놀로지	130백만원 (정액기술료)	반도체 소장 불량분석 장치 및 방법
기술개발 내용	<p>○ 반도체소자의 불량에 의해 발생하는 국부적인 발열영상을 고분해능으로 측정하고, 반도체 미세패턴 영상과 중첩하여 고정밀도로 불량위치를 추적/분석할 수 있는 반도체 불량 검사장비 기술 개발</p> <div style="text-align: center;">  <p>〈반도체소자 불량분석 시스템 사진, Prototype〉</p> </div>		
기술이전 내용 및 의의	<p>○ 반도체소자 제조에 있어 수율향상, 생산성 극대화를 위해 필수적인 반도체소자 불량 검사 장비 기술이 산업체에 130백만원으로 이전돼 국내외 반도체소자 제조 및 불량분석산업에 적용되는 상용화 단계에 진입</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 반도체 불량 검사장비는 반도체산업 전반으로 파급효과가 큰 핵심기술임에도 불구하고 전량 수입에 의존하고 있음 ■ 해외의 기술 선진사들이 선점하고 있는 특허회피를 위해 상용화 되지 않은 새로운 원리를 적용하여 기존 상용장비보다 불량검사 정밀도가 향상된 차세대 불량 검사장비 국산화 ■ 기술이전으로 전량 수입에 의존하던 불량분석 장비 시장에서 연 평균 100억원에 달하는 경제적 효과를 창출할 것으로 전망 		